

Parallel Test mit der Lambda edition

Unsere In-Circuit-Tester in der Lambda edition verkürzen die Taktzeiten und erhöhen den Durchsatz. Die Entwicklung der Technologie hat neue Produktdesigns hervorgebracht. Diese werden immer kleiner und komplexer. Oft können einzelne Bauelemente wegen diesen Veränderungen nicht, oder nur aufwendig getestet werden. Das führt zu einer Erhöhung der Taktzeiten.

Wie viel Zeit Sie dadurch sparen, können Sie leicht ausrechnen:
 $(\text{Taktrate} - 25\%) - (\text{Ladezeit} + \text{Entladezeit}) = \text{kürzere Testzeit}$

Lambda edition: paralleles Testen von Leiterplatten als Lösung

Mit dieser Technik können Sie gleichzeitig zwei oder mehr Baugruppen testen und so die Taktzeiten optimieren und die Testzeit verkürzen oder die Tests auf dem schnellsten Weg durchführen.

Ein ICT oder Funktionstest wird von zwei oder mehr unabhängigen Testköpfen ausgeführt und dadurch die Prüfzeit um den entsprechenden Faktor reduziert. Dies gilt für einen Mehrfachnutzen ebenso wie für mehrere unabhängige Einzelprüflinge.

Die Lambda edition mindert so die Testzeit bei zwei Prüflingen beispielsweise um 50 Prozent, bei vier um 75 Prozent und so weiter.

Optimale Unterstützung: Nutzentest dadurch noch effizienter

Die Lambda edition unterstützt zudem den Nutzentest optimal. Durch die Kombination mit einem Flashrunner, können auf Digitaltest-Testsystemen Multi-Panel-Boards völlig unabhängig parallel getestet und programmiert werden. Das spart nicht nur Produktionszeit, sondern auch Warte-, Inspektions- und Handlingzeiten.

Vorteile des parallelen Testens kompakt zusammengefasst

- > Baugruppen können ohne zusätzlichen Aufwand getestet werden
- > Leistungsfähige und sensible Softwareumgebung
- > Kleine, kostengünstige Testköpfe
- > Geringe Hardwarekosten und geringer Platzbedarf
- > Optimierte Taktzeiten

